## ПРОЦЕСС УДАЛЕНИЯ ФОТОРЕЗИСТИВНОГО СЛОЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТНОГО БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА

Тубольцев В.В., Барахоев А.Л., Тихон О.И. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники г. Минск, Республика Беларусь

Бордусов С. В. – профессор, докт. техн. наук

Процессы непрецизионной обработки кремниевых пластин с целью активации, удаления фоторезиста, очистки от загрязнений являются достаточно актуальными в настоящее время. Выполнение этих операций путём сухой плазменной обработки, в основном с применением вакуумной техники, связано с большой энергоёмкостью и крупными габаритами оборудования [1]. Одним из альтернативных методов реализации процесса удаления фоторезистивных плёнок является обработка с использованием озоновоздушной смеси, формируемой в послесвечении разряда барьерного типа атмосферного давления [2-4].

Для проведения экспериментов был разработан исследовательский стенд. Структурная схема исследовательского стенда представлена на рис.1, а.

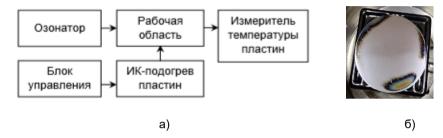


Рисунок 1 – Структурная схема исследовательского стенда (a) и вид расположенной на керамическом нагревателе пластины (б) (на поверхности пластины есть остатки фоторезиста).

Формирование озоно-воздушной смеси осуществлялось при помощи озонатора, основанном на поверхностном барьерном разряде, создаваемом электродами в виде параллельных полос. Рабочая область находилась в реакционной камере, состоящей из металлической камеры в которой находился керамический нагреватель мощностью 450 Вт. На нагревателе непосредственно располагалась пластина. В отверстие в верхнем фланце, закрывающем камеру, находился штуцер, через который подавалась смесь.

Задачей исследования являлось изучение влияния концентрации озона, характера его подачи к поверхности и температуры пластин на процесс удаления фоторезистивной плёнки.

Экспериментальными образцами выступали кремниевые пластины диаметром 100 мм. На поверхность пластин в стандартных для промышленности условиях был нанесён слой фоторезистивной маскирующей плёнки S1813 толщиной 1,35 мкм. Процесс обработки выполнялся в условиях принудительной подачи в электроразрядную камеру озонатора воздуха с расходом 11,3 л/мин. Обрабатываемые пластины нагревались до T = 250 °C, время обработки составляло 7 минут. Регулируемым параметром являлось расстояние I между пластиной и штуцером подачи озоновоздушной смеси. На рис. 1, б. показано расположение кремниевой пластины в металлической камере технологического блока.

Результат, показанный на рисунке, был получен при I = 1 см. На пластине наблюдаются остатки фоторезиста, занимающие ~15% от её площади. Скорость удаления материала в этом случае составила 0.886 мг/мин.

В результате экспериментов установлено, что за счёт повышения распределённости потока рабочего газа и сохранения равномерности нагрева образца обеспечивается более качественный результат процесса удаления фоторезистивных плёнок с поверхности кремниевых пластин. Проведённые эксперименты показали достаточно высокую эффективность и возможность внедрения данного метода обработки вместо вакуумно-плазменных процессов.

## Список использованных источников:

- 1. Hess D. W. Plasma Stripping, Cleaning, and Surface Conditioning / D. W. Hess, K. A. Reinhardt // Handbook of Silicon Wafer Cleaning Technology / ed.: Reinhardt K. A., Kern W. 3rd ed. Oxford: William Andrew, 2018. Ch. 7. P. 379–455.
- 2. Huynh C. K. Plasma versus ozone photoresist ashing: Temperature effects on process-induced mobile ion contamination / C. K. Huynh, J. C. Mitchener // Journal of Vacuum Science & Technology B. − 1991. − Vol. 9, № 2. − P. 353–356.
- 3. Gardner W. L. Temperature and concentration effects on ozone ashing of photoresist / W. L. Gardner, A. P. Baddorf, W. M. Holber // Journal of Vacuum Science & Technology A. − 1997. Vol.15, № 3. − P. 1409–1412.
- 4. Miura T. Photo-resist Removal using Highly Concentrated Ozone Gas. Removal Characteristics of Various Resists / T. Miura, M. Kekura, H. Horibe, M. Yamamoto // Journal of Photopolymer Science and Technology. − 2008. Vol. 21, № 2. − P. 311–316.